

# 集成电路-冲击试验-电子电器、电气和电力试验报告

产品名称	集成电路-冲击试验- 电子电器、电气和电力试验报告
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网社会责任：1、合作共赢、回馈社会2、百检网检测平台严格秉承社会价值观念和道德规范，将回馈社会作为企业经营发展应尽的责任，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。3、百检网主动履行社会责任，稳健开展投资业务，与合作伙伴一起推动地方经济的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。4、百检网对供应商、客户坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履约，与合作伙伴建立并维持良好的关系，创建沟通交流平台，进行优势互补，构筑共赢格局。

1 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.4 X射线照相

2 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3c) 两个或三个引出端之间电测试

3 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 b) 外壳绝缘

4 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.1 外部检查

5 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.4 e) 扫描电子显微技术和电子束显微分析

6 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 a) 阈值试验

7 《半导体器件 机械和气候试验方法 第6部分:高温贮存》 IEC 60749-6 : 2002 高温贮存

8 《半导体器件 机械和气候试验方法 第9部分:标准耐久性》 IEC 60749-9 : 2002 标志耐久性

9 《半导体器件 机械和气候试验方法 第5部分:稳态温湿度偏置寿命验》 IEC 60749-5 : 2003 稳态温湿度偏置寿命验

10 《半导体器件 机械和气候试验方法 第10部分:机械冲击》 IEC 60749-10 : 2002 机械冲击

11 《半导体器件 机械和气候试验方法 第36部分:恒定加速度》 IEC 60749-36 : 2003 恒定加速度

12 《半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分:盐气》 IEC 60749-13 : 2002 盐气

13 《半导体器件 机械和气候试验方法 第8部分:密封》 IEC 60749-8 : 2002 密封

14 《半导体器件 机械和气候试验方法 第21部分:可焊性》 IEC 60749-21 : 2004 可焊性

15 《半导体器件 机械和气候试验方法 第22部分:键合强度》 IEC 60749-22 : 2002 键合强度